

第5回XAFS討論会のご案内

X線吸収微細構造(XAFS)は、物質の構造解析と電子状態の研究手法として定着し、その研究分野の拡張と共にユーザー層の広がりでも目覚ましいものがある。また近年、高輝度光源の利用による新たな試みと展開も期待され、基礎研究と共に材料科学の応用分野からも新たなユーザーがXAFSを利用するようになってきている。XAFS討論会は、XAFSの理論、実験、データ解析、応用に関する研究者が一堂に会し、研究発表を行うと共に議論する事を目的として1998年から毎年開催されている。奮ってご参加下さいます様ご案内申し上げます。

1. 会 期 2002年8月1日(木)~3日(土)
2. 会 場 広島大学 学士会館2階(レセプションホール)
〒739-8526 東広島市鏡山1-3-1
3. 主 催 日本XAFS研究会
共 催 広島大学 放射光科学研究センター(HiSOR)
協 賛 日本放射光学会、日本化学会、日本分析化学会、日本物理学会、応用物理学会、
触媒学会、日本結晶学会

4. プログラム

特別講演および一般講演から成るシングルセッション。

特別講演：

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 「共鳴X線散乱の機構」 | 五十嵐潤一氏 (JASRI/SPring-8) |
| 「放射光核共鳴散乱研究の展開」 | 瀬戸 誠氏 (京都大学原子炉) |
| 「光電子顕微鏡を用いた軟X線磁気円二色性顕微分光」 | 今田 真氏 (大阪大学基礎工学部) |

最終日午後、広島大学放射光科学研究センター(HiSOR)の見学会を計画している。

5. 参加費(講演要旨集1冊を含む)

日本XAFS研究会会員 1,000円、 一般 3,000円、 学生 1,000円

6. 講演申込

フォーマットを<http://xafs5.sci.hiroshima-u.ac.jp/>よりダウンロードのうえ

e-mail、FAX、または郵送にて下記までお申し込み下さい。

締切は 6月7日(金) <必着>

7. 問合せ先 〒739-8526 東広島市鏡山1-3-1

広島大学大学院理学研究科 物理科学科 圓山 裕

e-mail : xafs5@sci.hiroshima-u.ac.jp

TEL : 0824 - 24 - 7386 FAX : 0824 - 24 - 0717

詳細は <http://xafs5.sci.hiroshima-u.ac.jp/> をご覧下さい。